

第 40 回分析電子顕微鏡討論会のお知らせ

主催：公益社団法人 日本顕微鏡学会 分析電子顕微鏡分科会

協賛：軽金属学会、日本金属学会、日本材料学会、触媒学会、日本熱処理技術協会、日本表面真空学会、日本鉄鋼協会、日本分析化学会、応用物理学会、日本セラミックス協会、日本物理学会（依頼中含む）

日 程：2025 年 12 月 4 日（木）、5 日（金）

方 法：オンラインでの開催

定 員：150 名

参加費（予稿集含む）：顕微鏡学会員及び協賛学会員（個人会員）3,000 円、非会員 4,000 円、学生 1,000 円

※参加費はすべて税込となります。

内 容：分析電子顕微鏡に関わるチュートリアルと研究トピックスについて講演が行われます。「チュートリアル」では、分析電顕の基軸となる EDS、EELS、STEM の基礎について詳しい講演がなされます。初日のトピックセッションでは、「分析 TEM の実践」に焦点をあてて、より実践的な分析 TEM 利用についてのノウハウやその応用例を装置メーカー講師の方よりご紹介いただきます。二日目は「(S)TEM によるひずみ解析の最先端」に関する講演、ならびに「試料作製」に関するチュートリアル講演がなされます。分析電顕に関わる活発な討論の機会となりますよう奮ってご参加ください。

詳細は <https://sites.google.com/view/bunseki-touron-40/> をご覧下さい。

申込方法：参加申し込みは氏名、勤務先、所属、住所、電話番号、Fax 番号、e-mail アドレス、申込資格（会員・協賛学会員・学生・非会員）をご記入の上、e-mail にて下記連絡先へお申し込み下さい。
参加費のお支払方法などについては折り返しご連絡差し上げます。

申込締切：2025 年 11 月 25 日（火）

連絡先：〒060-8628 札幌市北区北 13 条西 8 丁目

北海道大学大学院工学研究院附属エネルギー・マテリアル融合領域研究センター
マルチスケール機能集積研究室

分析電子顕微鏡討論会事務局 坂口 紀史

Tel&Fax: 011-706-6768 E-mail: bunseki.touron.40@gmail.com

第 40 回分析電子顕微鏡討論会プログラム

(2025 年 8 月 9 日現在)

12 月 4 日(木) 9:30-16:00

チュートリアル (座長：佐藤庸平)

- | | | |
|--------|-------------|-----------------|
| 9:30- | EDS の基礎 | 川畑正伸 (アメテック) |
| 10:10- | EELS の基礎と応用 | 吉川純 (物質・材料研究機構) |
| 10:50- | STEM 位相法の基礎 | 関岳人 (東京大学) |
| 11:30- | 休憩 (10 分) | |
| 11:40- | Q&A (20 分) | |

— 昼休み (12:00-13:30) —

トピック 1 「分析 TEM の実践」 (座長：朝山匡一郎)

- | | | |
|--------|-------------|----------------------------|
| 13:30- | 実践 STEM 講座 | 奥西栄治 (日本電子) |
| 14:10- | 実践 EDS 講座 | 松本弘昭 (日立ハイテク) |
| 14:50- | EELS の基礎と実践 | 中西伸登 (サーモフィッシャーサイエンティフィック) |
| 15:30- | 休憩 (10 分) | |
| 15:40- | Q&A (20 分) | |

12 月 5 日(金) 10:00-16:00

試料作製 (座長：矢口紀恵)

- | | | |
|--------|---|--------------|
| 10:00- | 試料作製方法 | 谷口俊介 (日本製鉄) |
| 10:30- | FIB-SEM と EBSD を用いた特定方位からの TEM 試料作製 ～大気非曝露環境下 | 三平智宏 (日本電子) |
| 11:00- | ソフトマテリアルのための電子顕微鏡用試料作製 | 中山智香子 (日本電子) |
| 11:30- | 休憩 (10 分) | |
| 11:40- | Q&A (20 分) | |

— 昼休み (12:00-13:30) —

トピック 2 「(S)TEM によるひずみ解析の最先端」 (座長：村上恭和)

- | | | |
|--------|--|---------------|
| 13:30- | 4D STEM を用いた歪み解析と各種技術 | 佐伯哲平 (アメテック) |
| 14:00- | 5D-STEM によるピコ秒音響波および GHz 音響分散計測 | 中村飛鳥 (理化学研究所) |
| 14:30- | DM Plugin によるひずみ解析 ～GPA,PPA,HoloDark,sMoire～ | 石塚顕在 (HREM) |
| 15:00- | 原子分解能 STEM 像からの高精度格子定数測定とその応用 | 佐藤幸生 (熊本大学) |
| 15:30- | 休憩 (10 分) | |
| 15:40- | Q&A (20 分) | |